[51]Int.Cl6

G03F 1/14 H01L 21/00



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 95113199.0

|43||公开日 1998年6月3日

[11] 公开号 CN 1183579A

[22]申请日 95.12.28

[30] 伐先权

[32]94.12,28[33]JP[31]327512 / 94

[71]申请人 日本电气株式会社

地址 日本东京都

[72]发明人 佐仓宜语

|74||专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 代理人 萧扬昌 邹光新

权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图页数 9 页

|54||走明名款 用由假图形所形成的光劃腔掩模将层帮 确构图或目标图形的方法

[57]扬要

由于显影后烘烤中的收缩而使光刻腔掩模(23a)的表面中出现张力,而形成于光刻腔掩模中的粘附力(23c)吸收了该张力,因而保特对半导体衬底(22)粘附力,防止了光刻胶图形出现不希望的变形。

